#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-158455

filnt, Cl. 3 14/06 識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)7月8日

C 23 C C 01 B C 23 C

101 Z

8722-4K 6345-4G

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全11頁)

非晶質炭素、その製造方法、および非晶質炭素被覆部材 ❷発明の名称

> 頭 平1-296964 ②特

願 平1(1989)11月15日 22出

⑩発 明 者

東京都千代田区丸の内3丁目1番1号 出光石油化学株式

会社内

出光石油化学株式会社 ⑪出 願 人

東京都千代田区丸の内3丁目1番1号

弁理士 福村 直樹 四代 理 人

#### 1.発明の名称

非晶質炭素、その製造方法、および非晶質炭素

- 2 . 特許請求の範囲
- (1) 水素含有量が2~20原子%であり、かつ熱 膨張係数が3.0 × 10 % ~ 3.0 × 10 5/℃である ことを特徴とする非品質炭素。
- (2) イオン化した炭素額ガスのイオンを加速電 圧により加速して 茜材に 衝突させ、 茜材上に非晶 質炭素を析出させることを特徴とする非品質炭素 の製造方法。
- (3) 基材に、請求項1に記載の非品質炭素を被 攫したことを特徴とする非晶質炭素被覆部材。
- (4) 前記基材が炭化タングステン系超硬合金 である前記請求項3に記載の非品質炭素被覆部
- (5) 炭化タングステン系超硬合金と非晶質炭素 との界面から該非品質炭素の方向に0.1 μ皿まで

の深さにおける全タングステン原子と全炭素原子 との合計量に対する全コパルト原子の含有額合 が、5モル%以下である請求項4記載の非品質炭 素被覆部材。

3 . 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、非晶質炭素、非晶質炭素の製造方 法、および非晶質炭素被覆部材に関する。

[従来技術と発明が解決しようとする課題]

従来、ダイヤモンド切削工具等のダイヤモンド 工具は、超硬合金や高硬度の金属類やセラミック 類等の母材の面上に、漁結ダイヤモンドや単結晶 ダイヤモンドをろう付け等により接着形成してな

もっとも、旋結ダイヤモンドや単結晶ダイヤモ ンドを表面層に設けた切削工具であって、表面が 複雑な形状をしているチップは、宋だ存在しな い。というのは、ダイヤモンド自体が魅加工性物 気であるからである.

これに対して、近年、CVD法やPVD法など

の気相法ダイヤモンド台皮技術を用いて、超硬合金や高硬度の金属類やセラミック類等からなる母材や部品の裏面にダイヤモンド酸を折出させ、これをそのまま工具チップや耐摩託性部品等とするダイヤモンド被優部材の製造が検討されている。

中でも、VC-Co系の超硬合金にプラズマCVD 法等によりダイヤモンド酸を形成し、切削工具等 として利用しようとする試みが数多くなされてき た(特別昭63-100182号公根など参照)。

しかしながら、これらの従来のダイヤモンド設 被履部材においても、超硬合金とダイヤモンド設 との密着性が依然として思く、切削チャプ等とし ての十分な耐久性が得られない。たとえば、VCー Co系超硬合金母材にプラズマCVD法でダイヤモ ンド酸を形成してなる被関部材について、スク ラッチ試験により密着性を評価したところ、クリ ティカルロードで高々15 N程度の低い値しか得ら れず、これをチップとしてケイ素含有アルミニウ ム (Si 12%) を切削したところ、ダイヤモンド酸

そこで、比較的に最近、WC-Co系超硬合金に代えて前記ダイヤモンド腹に熱膨張係数が近い窒化けい素系セラミック等のセラミック類からなる切削工具母材にダイヤモンド腹を形成し、これをそのまま切削チップとするダイヤモンド腹被覆切削工具が提案されている。

しかし、この場合、切削工具等の超硬工具の母材としてセラミック類を使用すると、超硬工具の 物性が低くなるなどの新たな問題点が生じる。

以上の点に鑑みると、もし、従来のダイヤモンド膜に代えて選当な熟聴愛係数を有する新しいタイプのダイヤモンド膜を得ることができるならは、強度や勧性等の特性に優れた、MC-Co系超硬合金等の炭化タングステン系超硬合金に、中間層を介すことなくそのような新タイプのダイヤモンド膜を、直接に密着性よく形成させることができて、切削工具やドリル等の超硬工具などの長寿命化を図ることができると期待される。

しかしながら、従来、そのような超硬合金に対 して高い密着性を有するダイヤモンド膜は知られ が剝離し使用不可能であった。

ところで、このように超硬合金とダイヤモンド 限との密着性が悪い主たる理由は、それらの熱部 関係数の違いが大きく、そのため円者の間で大き な熱収縮応力が生じるからであると考えられ。

そこで、この熱収銀応力をできるだけ緩和し、 密着性を向上させようとする試みとして、超硬合 会とダイヤモンド股層との間に中間層を形成する 技術も数多く提案されてきた。例えば、特開昭 58-126972 号公報には、超硬合金の表面に先ず 取 o , V a , VI a 族金属の炭化物、窒化物、ホウ 化物および酸化物から選ばれた一種以上よりなる 中間層を形成し、その後に試中間層の上にダイヤ モンド膜を形成してなるダイヤモンド膜付き超硬 合金が配載されている。

しかしながら、この場合、密着性を十分に向上させるためには、基材とダイヤモンド膜の双方に対して密力性を十分に満足する中間層を形成する必要があるので、その製造は容易ではなく、一般に複雑な製造工程が必要である。

ていない。

本発明は、上記の事情に鑑みてなされたもので ある。

水免明の目的の一つは、密着性の良好な膜として超硬合金の裏面に直接に形成することのできる 非晶質炭素を提供することにあり、

また、本発明の他の目的は、前記非晶質炭素を製造する方法を提供することにあり、さらには、前記非晶質炭素を使用して得られる非晶質炭素被関部材を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

前記目的を達成するための本発明は、水楽含有量が2~20原子%であり、かつ無路張係数が3.0×10・4~3.0×10・3/でであることを特徴とする非晶質皮素であり、

イオン化した炭素類ガスのイオンを加速電圧により加速して基材に衝突させ、基材上に非晶質炭素を折出させることを特徴とする非晶質炭素の製造方法であり、

基材に、水素含有量が2~20原子%であり、か

つ熱脳受傷数が3.0 ×10·4~3.0 ×10·5/でである非品質炭素を放棄したことを特徴とする非品質炭素を放棄した。

前記非品質炭素故環部材においては、前記基材 が炭化タングステン系組硬合金であるのが好まし く、

府記弈品質炭素被覆部材においては、炭化タングステン系組硬合金と非品質炭素との界面から該 非品質炭素の方向に 0.1 μ 血までの深さにおける 全タングステン原子と全炭素原子との合計量に対 する全コバルト原子の含有組合が、 5 モル%以下 であるのが好ましい。

本発明で言う非温質炭素は、ラマンスペクトルにより容易に同定することができる。すなわち、ラマンスペクトル分析により、非晶質状の炭素を示す1.400 cm・1~1.600 cm・1付近に保広ビークを有することにより本発明で言う非品質炭素を特長づけることができる。なお、この非晶質炭素においては、本発明の目的を観许しない難り、そ

水素含有量が 5 ~ 10原子%の範囲内にあるのが好ましく、一方、熱膨型係数が 4.6 × 10・6~ 5.6 × 10・6/ での範囲内にあるのが好ましく、また基材として鉄系金属を使用するときには、水業含有量が 5 ~ 10原子%の範囲内にあるのが好ましく、一方、熱膨型係数が 7.0 × 10・6~ 1.4 × 10・5/ での範囲内にあるのが好ましい。

ここで、水来含有及は、赤外分光スペクトルにおける3.000 cm・付近の核分吸収強度により算出する簡便な方法により決定することができる【参照: Y. Tavado, JARECT, vol6, Amorphous Semiconductor Technologice & Devices(1983)

すなわち、放数 ν c m リにおける吸収係数α (ν) から、水素含有量 N κ は次式

$$N_{H} = \frac{1}{B} \int \frac{\alpha(y) dy}{y}$$

で与えられる。ここで、Bはa-SiC-Hの研究から、B=1×10-11 cm-1と仮定すること。 また、扱分は 3,000cm-1付近の共鳴吸収の変わ の一部にダイヤモンドあるいはダイヤモンド状皮 素が忍入していても良い。\_

そして、本発明で重要なことは、その非品質炭 常は、前記特定の水素合有量および熱膨受係数を 有することである。

ここで、その熱酸受係数が上記の範囲内にあっても、水素合有量が2原子が未換であるとグラファイト化が進み軟質な設が形成され、一方、20原子%を越えると得られる設は高分子化するとともに軟質になり、また、たとえ水素含有量が2~20原子%の範囲内にあっても、熱態受係数が3.0×10・1/で未過であると、同材である広村との告替性が悪くなり、一方、3.0×10・3/でを越えると、上記と同様に密着性が悪くなり、本発明の目的を連成することができない。

なお、水業含有量および热膨張係数が上記の範囲内にある非晶質炭素の中でも、基材として炭化タングステン系超硬合金、特にWC-Co系超硬合金を使用するときには、基材との密着性等をさらに一層改容することができるという点からすると、

れる全域で行なう。

本発明における前記非品質皮素は、その製造方法としては特に制限はないが、造常は炭素製ガスを適当な手段で励起し、基材而上に折出させる方法、 好ましくは後述の本発明の方法によって製造される。

折出させる基材の種類には、特に制限がなく、 どのような基材を用いてもよい。

この場合、非品質皮質は、基材上に形成させた 状態で利用してもよく、あるいはこれを基材から はがしたり、けずり取るなどして基材のない状態 で利用することも可能である。もっとも、切削工 具やドリル等の超硬工具などの母材として紆適な 性能を有する皮化タングステン系超硬合金や鉄系 金属等に対してもこの非品質皮素膜は高い密着性 を示すので、基材として炭化タングステン系超硬 合金あるいは鉄系金属を用い、前記基材上に形成 させた状態で利用するのが良い。

それ故、本発明の非晶質炭素被覆部材において は、前記基材として炭化タングステン系超硬合金 および鉄系金属等を使用し、前記基材の所望の面上に前記非品質炭素を膜状に設ける。

前記世化タングステン系超硬合金としては、各種のものが使用可能であるが、中でもWC-Co系超硬合金などが好ましく、特にCo含有量が5重量%以下であるWC-Co系超硬合金が好ましい。

どのような種類のWC-Co系組硬合金を使用する かは、使用目的等に応じて適宜に選択すればよい。

前記鉄系金属としては、たとえば、工具に使用される炭素鋼であって、記号SKI~7で示されるもの、工具等に使用される合金鋼であって、記号SKS、SKD、SKH、SKTで示される各種のものを挙げることができる。

どのような種類の飲料金属を使用するかは、使 用目的等に応じて適宜に選択すればよい。

使用する基材の形状としては、特に制限がなく、どのような形状であっても良い。 すなわち、非品質炭素膜を設けようとする基材は、切削工具やドリル等の超硬工具、摂動部品等の母材として

ることが好ましい。上記の特定の界面付近組成を 有するものは、特に密着性が優れており、非晶質 炭素膜の斜離も生じにくく、切削工具やドリル等 の超硬工具や複動部品等として用いたときに、よ リー層の耐久性および寿命等の改容効果を奏する ことができる。

なお、一般にCoを含有する世化タングステン系 超硬合金を基材とし、これに従来のプラズマCV D 法等のCVD 法などの気相合成法によりダイヤ モンド状皮素膜を形成させると、前記したように 界面付近にCoが析出し、もろいっ層が生成なると、 う重大な問題がある。また、Co含量が多くなると は実膜との熱膠蛋係数が大きくなり、ダイヤモンド状 皮素膜との熱膠蛋係数の差が広がり、その結果、 熱収縮応力が増加し、ダイヤモンド状皮素膜の密 着性が低下する。つまり、界面付近のCo含有量が 多くなるほど、一般に密着性は低下する。

このような点から、基材として皮化タングステン系組硬合金を使用するときには、界面付近のCo

成形されていてもよく、あるいは特定の形状に成 形加工されていなくてもよい。

本発明の非品質改素被優部材における、非品質 炭素膜の厚みとしては、特に制度はないが、通常 1~10μm、好ましくは3~8μmである。

この関係が移すぎると、耐摩耗性の向上が不十 分になったり、切削工具やドリル等の超便工具な どとしての性能が十分に発揮できないことがあ る。一方、あまり厚すざると、膜の剝離が生じや すくなり、寿命が低下することがある。

合量を5 モル%以下に制限して、前記非晶質皮素を形成するのが好ましい。

本発明の非晶質炭素は本発明の方法によって好適に製造することができる。この方法によれば、 基材として炭化タングステン系超硬合金あるいは 鉄系金属を選択することにより、木発明の非晶質 炭素被覆部材を容易に製造することができる。

なお、この方法における非晶質皮素膜の合成手法は、炭化タングステン系超硬合金あるいは鉄系金属以外の他の基材の場合についても好適に応用することができる。

以下に、本発明の方法について図面を参照しながら詳細に説明する。

第1回は、本発明の非晶質炭素被覆部材の製造 方法において好適に使用することができる非晶質 炭素合成装置の構成の一例を示す概念図である。

第1 図に示すように、非晶質炭素合成装置 1 に おいて、非晶質炭素を基材 8 の面上に形成し、非 晶質炭素被覆部材を製造する場合、炭素製ガスを ガス導入口 3 から供給し、導入した炭素製ガスの 少なくとも一部をフィラメント (カソード) 5 により加熱・励起して、さらにフィラメント (カソード) 5、アノード 8 にてプラズマを発生させて生成した炭素含有陽イオンをトリオード7 にさらに基材 8 に向けて加速して基材 8 の変面に専き、基材 8 の所定の面上に s p 1 執道の C - H を含有する形で炭素を析出させて、非品質炭素膜を形成させる。

なお、その際、重要な点のひとつは、基材 8 の 非晶質皮素を形成する予定の面の近傍に、第 3 の 電極であるトリオード7を配設しておき、前記ト リオード7に負の電位を印加し、阿時に負の電位 を印加した基材 8 に高周波を付加しつつ前記非品 質皮素の形成を行う点である。

この負の電位を印加したトリオード7の働きにより、アノード6を通過した炭素含有關イオンはさらに大幅に加速され、基材8に打ち込まれるように衝突し、その結果、前記したように一部の炭素が基材8の深くまで侵入し、Coの折出(界面付近への濃縮)を切止することができ、前記ヵ層の

ガスを使用することができる。これらの中でも、 C - H 結合を有するのが好ましく、特に炭化水素 が好ましい。

前記炭化水素としては、例えばメタン、エタン、プロパン、ブタン等のパラフィン系皮化水素:エチレン、プロピレン、ブチレン等のオレフィン系皮化水素:アセチレン、アリレン等のフィンチレン系皮化水素:ブタジエン等のジオレフィンス皮化水素:シクロブロパン、シクロブタン、シクロペンタン、シクロペンサン等の胎頭式皮化水素:シクロブタジエン、ベンゼン、トルエン、キシレン、ナフタレン、アントラセン等の芳香族皮化水素などを挙げることができる。

前記含ハロゲン化合物としては、たとえば、四ファ化皮素、四塩化皮素のようなハロゲン化メタン、ヘキサフルオロエタン、テトラフルオロエチレンのようなハロゲン化エタン、ハロゲン化ペンゼン等の含ハロゲン化炭化水素等を挙げることができる。

ここで、ハロゲン原子としてはフッ素原子、塩

生成を抑郁することができる。

また、負の電位を印加した基材 8 に高周波を付加することにより前記したように非晶質炭素の膜 ロを十分に増加させることができる。

なお、第1図の例では、トリオード7への負の で位の印加は、第1直流電板IIによってなされ、 一力、基材8への負のバイアス電位の印加は第2 直流電板IOにより、および高周波の付加は高周波 電板9によりなされる。

前記炭素額ガスは、少なくとも炭素と水素とを 含有するのであれば単独ガスであっても混合ガス であってもよい。

具体的には、 通常は、 分子中に C と H を 有する 炭素製ガスが舒適であり、 場合により皮素観ガス と水素ガスとの混合ガスを使用してもよい。

また、所望により、前記改業数ガスとともに、 アルゴン等の不活性ガスなどを稀択ガスもしくは キャリヤーガスとして用いることもできる。

前記炭素額ガスとしては、各種炭化水素、含ハロゲン化合物、含酸素化合物、含酸素化合物、含酸素化合物

素原子、臭素原子等を挙げることができる。中で もフッ素原子などが好ましい。

前記合敵業化合物としては、例えばアセトン。 ジェチルケトン、ペンゾフェノン等のケトン類; メタノール、エタノール、プロパノール、ブタ ノール等のアルコール類:メチルエーテル、エチ ルエーテル、エチルメチルエーテル、メチルプロ ピルエーテル、エチルプロピルエーテル、フェ ノールエーテル、アセタール、周式エーテル(ジ オキサン、エチレンオキシド等)のエーテル類: アセトン、ピナコリン、メチルオキシド、芳香族 ケトン(アセトフェノン、ペンゾフェノン等)、 ジケトン、頂式ケトン等のケトン類;ホルムアル デヒド、アセトアルデヒド、ブチルアルデヒド、 ベンズアルデヒド等のアルデヒド類; 半酸、酢 酸、プロピオン酸、コハク酸、酪酸、シュウ酸、 潤石酸、ステアリン酸等の有機酸氢:硫酸メチ ル、酢酸エチル等の酸エステル類:エチレングリ コール、ジエチレングリコール等の二価アルコー ル類等を挙げることができる。

前記含窒素化合物としては、例えばトリメチルアミン、トリエチルアミンなどのアミン類等を挙 げることができる。

また、 向記皮化水素ガスとして、 単体ではないが、 前防法に規定される第4類危険物: ガソリンなどの第1石袖類、 ケロシン、テレビン袖、 しょう解油、 松根袖などの第2石袖類、 重袖などの第3石袖類、 ギャー油、 シリンダー油などの第4石 油類などのガスをも使用することができる。

上記各種の炭素額ガスの中でも、常温で気体または蒸気圧の高い化合物、たとえばメタン、エタン、プロパン等のパラフィン糸炭化水素、ペンゼン、トルエン、キシレン、ナフタレン、アントラセンなどの芳香族炭化水素、あるいはアセトン、エチルメチルケトン等のケトン類、メタノール、エタノール等のアルコール類などを舒適に使用することができる。

これらの中でも、特にペンゼンなどのイオン化 しやすい化合物が特に舒適にである。

なお、これらは一種単独で使用してもよいし、

ド5の電位を基準(0 V)として通常-100 ~ -3,000 Vにするのが良い。

この電圧の絶対値があまり小さすぎると、ダイヤモンド状度素膜等の非晶質皮素膜の厚みを十分に大きくすることができないことがある。

前記アノード 6 に印加する電圧は、前記カソード 5 の電位を基準 (0 V) として、通常 - 30 ~ - 200 Vに設定するのが適当である。

前記カソード 5 における電旋は、通常 5 ~ 50 A にするのが良い。

前記基材 8 に付加する高周被の出力としては、 通常 50~ 900 W にするのが適当である。この出力 があまり小さすぎると、ダイヤモンド状皮素限等 の非品質皮素限の厚みを十分に大きくすることが できないことがある。

前記原料ガスの疣量としては、通常20~100 SCCMに設定するのが良い。

前記アルゴン等のキャリアーガスを使用する場合、その流量としては、通常20~500 S C C M にするのが良い。

二種以上を併用してもよい。

前記改業額ガスとしては、そのほか、たとえば、一般化改業、二酸化改業等も使用することが できる。

なお、これらは一種単独で使用してもよいし、 二種以上を認合ガス等として併用してもよい。

前記世素額ガスは、上記のカソード5により助起・イオン化され世素合有限イオン(たとえば、CaHa・など)となり、上記したようにトリオード7により加速され、その一部もしくは大部分は基材8上に非品質世素の少なくとも世素成分となって折出する。

一方、前記炭素数ガス中の水素は、炭素合有場イオンに結合した状態で、あるいは別途に基材 8 の面に到達し、反応してその一部は非品質炭素の水素成分として取り込まれる。

前記非品質炭素を形成するに際してのガス圧と しては、通常 1 × 10<sup>-3</sup>~ 1 × 10<sup>-4</sup> forrとするのが 行選である。

前記基材に印加する電圧としては、 前記カソー

基材 8 の温度としては、通常、室温~400 ℃、 好ましくは室温~200 ℃の範囲に設定するのが良

以上のようにして非晶質炭素および本発明の非 晶質炭素被覆部材をはじめとする前記非晶質炭素 により被覆された各種の部材を好選に製造するこ とができる。

以上のようにして製造される非品質炭素は、少なくとも前記特定の水素含有量および熱膨型係数を有することら、従来にない新しいタイプの非品質炭素である。

等の性能が着しく改善される。

## [実施例]

次に、本発明を実施例および比較例によってさ ちに詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例 に及定されるものではない。

#### (実施例1)

第1図に示す非晶質皮素合成装置により、 飲料 ガスとしてペンゼン、キャリアーガスとしてアル ゴン、基材として皮化タングステン系超硬合金 ( VC-Co系超硬チップ)を用いて、以下の条件の下 に、前記基材上に非晶質広楽段を形成した。

ガス圧・・・・・・1 x 10-3Torr

カソード電流・・・・ 18A

アノード電圧・・・・ 100 V

トリオード電圧・・・ -600∨

高周抜出力・・・・ 300₩

基板電圧・・・・・-1,100V

将られた膜が非晶質状炭素であることはラマンスペクトルにおける1,400 cm·1~1,600 cm·1

けるSiC:Hより算出された値であり、1× 10-71 cm·1である。)

により積分することにより求められる。

第2回は、上配の方法で得た修正赤外線吸収スペクトルのチャートであり、上配の水実含有量は、このスペクトルのピークの上記による積分によって算出した。

また、前記Co含有量は、ESCA等により評価 した。

次に、前記のようにして得られた非晶質皮素膜 被環部材を、切削チップとして用い、以下の条件 設定の下に切削試験を行った。

被切削材·····Al-Si(Si 12%)

切削速度・・・・・400 m/min

送り・・・・・・・0.1 mm/rev

切り込み・・・・・0.25 ■■

その結果、 逸げ面摩託 0.3 mm までの切削距離 は、 25,000 mであり、 表面の担さ (Ra) は0.8 μmであり、また別の表面担さ (Rasa) は 1.0 μmと良好であった。

により確認された。そして、このダイヤモンド状 皮実膜の膜厚は約3 mmで、その水素含有量は約 8 原子%、熱磁張係数は5.1 ×10・4/でであっ た。また、界面付近のCo含有量は、0 モル%で、 カ層の生成は全く認められなかった。

なお、弁品質皮素膜中の水素含有量の評価は、 その赤外線吸収スペクトルから、以下のようにし て評価した。

## 水素含有最测定法

鉄料の赤外線吸収スペクトルを測定し、ベースラインを引き、その透過率下から、一般的な関係(T=Toexp[-ad]、ただし、Tは鉄料の透過率、Toは非晶質皮素を有しない鉄料の透過率、aは吸収係数、dは鉄料の厚み)から各被数。(col)における吸収係数a(a)を求め、第2図に示すような被数aと吸収係数aを各軸とする作正赤外線スペクトルチャートを得て、このスペクトルのピークを次式

C n = (1/B) ∫ [α (ω) /ω] d ω (但し、式中のBは、アモルファスシリコンにお

#### (比較例2)

前記実施例 1 における非晶質炭素膜被覆部材に 代えて、上記の非晶質炭素膜被覆を行っていない 超硬チップ、従来のTiN被覆チップを用いて、 前記実施例 1 と同様にして切削試験を行ったとこ ろ、前記切削距離は、それぞれ、1,500 mおよび 3,000 mであった。

実施例 1 の非晶質炭素膜被覆部材の寿命は、上記の組硬チップの約 6 倍であり、この比較例 1 における T ( N 被覆チップの約 2 倍と評価された。 (実施例 2)

超硬チップに代えて、超硬マイクロドリル(直径 0.5mm ) 母材を基材にして用いた以外は実施例 1 と阿様にして非品質皮素酸被用を行った。

将られた非晶質炭素膜被覆マイクロドリル(非晶質炭素膜厚約 3 μm)を用いて、プリント基材(厚さ1、6 mm) 3 枚を繰り返しショットし、パリが発生した時までのショット回数により寿命を評価した。

その結果、この実施例で得られた非品質炭素膜

被取マイクロドリルでは、パリの発生までのショット回数は、34,000ショットであり、着しく長い 寿命を示した。

## (比較例2)

市販の昼便マイクロドリルおよび市販のTIN 被関マイクロドリルを用いて、前記実施例2と同様にして寿命の評価を行ったところ、バリの発生 までのショット回数は、それぞれ、7,500 ショットおよび 15,000 ショットであった。

すなわち、実施例2にかかる非晶質炭素膜被限マイクロドリルの寿命は、上記市限の超硬マイクロドリルの約4.5 倍であり、TiN被覆マイクロドリルの約2.3 倍である。

#### (比較何3)

使来の並行平板型のプラズマCVD法により、 原料ガスとしてメタン(20sccN)と水素(50 sccN)の混合ガスを用い、基材として実施例1で 用いてたのと同じ起硬チョブを用い、圧力 0.1 Torr、RFパワー300 Wの条件の下に、前記基材 上に非晶質炭素膜を形成した。

ガス圧力・・・・・ 4.5 × 10-4Torr

カソード電流・・・・ 19A

アノード電圧・・・・ 110 V

トリオード電圧・・・ -600 V

高周彼出力・・・・ 350W

基板電圧・・・・・-1,000 V

得られた腹が非晶質炭素膜であることが、ラマンスペクトルにより確認された。そして、非晶質炭素膜は、約2μmで、その水素含有量は5原子%、熱膨張係数は7×10・4/℃であった。

第3図に非品質技楽膜コーティングドリルとコーティングなしのドリルとの評価比較を示す。 この評価においては、エポキシ樹脂を主体にする CFRPをドリルで穴あけ加工したときの穴あけ 開数(ショット数)と摩託幅との関係を調べた。

## [発明の効果]

本発明によると、超硬合金上に密着性よく形成 することのできる非晶質炭素およびその製造方法 を提供することができ、 得られた非品質炭素膜の膜厚は約3μmで、その水素含有量は約25原子%、無影要係数は2.6 × 10<sup>-4</sup>/でであった。また、界面付近には、Co<sub>1</sub>W<sub>1</sub>C (ヵ層)が約0.1 μmに渡って生成しており、尼S C A による測定の結果、界面付近0.1 μmの範囲内におけるCoの含有量は 10 原子%であることがわかった。

上記の非品質改素膜被理起硬チャブについて、 スクラッチ試験により密着性を評価したところ、 クリティカルロードは10Nであった。

また、上記の非晶質炭素膜被限超硬チャプを用いて、実施例1と同様にして切削試験を行ったところ、切削時間10秒で非晶質炭素膜が射離し、使用不能になった。

#### (実施例3)

実施例1と同様にして、非晶質炭素合成装置により、原料ガスとしてペンゼン、キャリアーガスとしてアルゴン、基材として鉄系金属 (SKH51製)ドリルを用いて、以下の条件の下に、前記基材上に非晶質炭素酸を形成した。

また、超便工具等の母材として好適な超硬合金上に密着性に優れた非晶質皮素膜等の非晶質皮素 皮膜を有し、耐摩耗性、耐久性等に優れ、切削工 具やドリル等の超硬工具、摺動部品等として用い たときに寿命を大幅に延長することができるなど の優れた利点を有する非晶質皮素被覆部材を提供 することができる。

## 4. 図面の簡単な説明

第1回の非晶質皮素および非晶質皮素被限部材を製造するために使用される非晶質皮素膜等の非晶質皮膜の合成装置の構成の一例を要す概念図である。

第2回は、本発明の非晶質炭素のうち典型的な 非晶質炭素の赤外線吸収スペクトルの一例を示す チャートである。

第3回は、実施例3の結果を示すグラフである。

1・・・非品質炭素合成装置、2・・・反応容 器、3・・・原料ガス導入口、4・・・排気口、

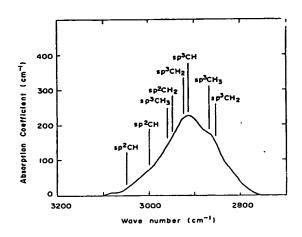
# 特開平3-158455 (9)

第 2 図

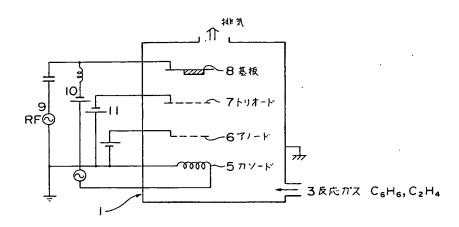
5・・・カソード、6・・・アノード、7・・・ トリオード、8・・・基材、9・・・高周波電 割、10対よび11・・・直流電額。

第2図の機能は、披敷ω (cm・1) を示し、緩動は、吸収係数α (cm・1) を示し、図中の記号は、 吸収グループの帰属を変す。

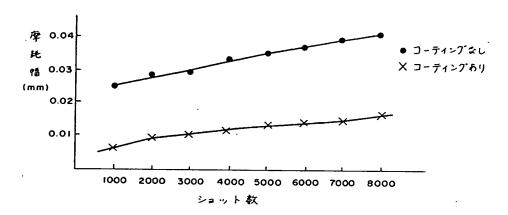




# 第 1 図



# 第 3 図



## 手 統 補 正 售

平成2年1月1日

1圈

# 特許庁長官 殿

1 事件の表示

平成1年特許願第296964号

2 発明の名称

非晶質炭素、その製造方法、および非晶質炭素 被覆部材

3 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住所 東京都千代田区丸の内三丁目1番1号

名称 出光石油化学株式会社

代表者 本郷 睦

4 代理人

住所

東京都新宿区西新宿七丁目18番20号

日生ピル6階

電話03-361-2738

氏名 弁理士(8759)福村直樹

5 補正命令の日付 発送日:なし(自発)

6 補正の対象 明細書の「特許請求の範囲」の機および

明知音の「特計調次の範囲」の機ちよ 「発明の詳細な説明」の機

# 7 補正の内容

- (1) 明細書の「特許請求の範囲」を別紙のとおりに補正する。
- (3)明細書の第5ページ第12行、第5ページ 第15行、第5ページ最下行にそれぞれ記載の「ダ イヤモンド膜」を、それぞれ「硬質炭素膜」に補 正する。
- (4) 明細書の第6ページ第13行、第6ページ最下行、第8ページ第7行、第8ページ第9行、第8ページ第9行、第24ページ第3行、第28ページ第6行 第8ページ第11行、第9ページ第5行、第24ページ第6行 まよび第29ページ第9行にそれぞれ記載の 「原子」を、それぞれ「a tom」に補正する。
- (5) 男相書の第7ページ第10行および第12ページ下から3行目にそれぞれ記載の「タングステン」を、それぞれ「コバルト」に補正する。
- (6)明細書の第19ページ下から第6行目に記載の 「エチルメチル」を「メチルエチル」に補正

特開平3-158455 (11)

する.

(7) 明細書の第21ページ第3行〜第4行、 第21ページ第13行〜第14行にそれぞれ記載の「ダ イヤモンド状炭素膜等の」を、それぞれ解除す る。

- (8) 明知曹の外21ページ下から第7行目に記載 の「殿の厚み」を「の合有割合」に補正する。
- (9) 明細書の第22ページ第10行に記載の「を有することら、」を「を有することから、」に補正する。
- (10) 明細客の第22ページ最下行に記載の「して そのよう各種部材は、」を「してそのような各種 部材は、」に補正する。
- (11) 明細書の第24ページ第1行に記載の「ダイヤモンド状」を「非品質」に補正する。
- (12) 明細費の第26ページ第9行に記載の「約6倍」を「約16倍」に補正する。
- (11) 明細書の第26ページ第10行に記載の「約2 倍」を「約8倍」に補正する。

h F

5 モル%以下である請求項 4 に記載の非品質炭素 被関部材。』 「特許請求の範囲」を下記のとおりに補正する。

æ

- 『(1) 水素合有量が 2~20<u>stom</u> %であり、かっ 熱脳張係数が 3.0 × 10<sup>-5</sup> ~ 3.0 × 10<sup>-5</sup> /でで あることを特徴とする非晶質炭素。
- (2) イオン化した炭素額ガスのイオンを加速電圧により加速して基材に衝突させ、基材上に非品質炭素を析出させることを特徴とする非晶質炭素の製造方法。
- (3) 基材に、請求項1に記載の非品質炭素を被限したことを特徴とする非品質炭素被視部材。
- (4) 前記基材が皮化タングステン系組硬合金である前記請求項 3 に記載の非晶質炭素複質部材。
- (5) 皮化タングステン系超硬合金と非品質炭素との界面から該非品質炭素の方向に 0.1 μm までの硬さにおける全<u>コバルト</u> 原子と全炭素原子との合計量に対する全コバルト原子の合有額合が、